課題番号 :F-19-NU-0061

利用形態 :共同研究

利用課題名(日本語) :各種材料の反応性プラズマのエッチング特性

Program Title (English) : Etching characteristics of Various Materials by Reactive IonEtching

利用者名(日本語) :本多啓志 Username (English) : K.Honta

所属名(日本語) :東ソー・クォーツ株式会社 Affiliation (English) :Tosoh Quartz Corporation

キーワード/Keyword :プラズマプロセス、膜加工・エッチング、形状・形態観察、分析

1. 概要(Summary)

低温プラズマ応用は、半導体プロセスでの利用に加え、 環境問題の解決、化学、バイオ分野での活用と拡大して いる。これらの利用領域で用いられる各種材料がプラズマ から受ける影響の把握が不可欠となっている。大気圧プラ ズマ照射により、被照射材料表面の清浄化と、その近傍 では結合状態が変化する。照射初期では清浄化が短時 間で進む。また、照射時間とともに被照射材料のダングリ ングボンドが増加した。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

超高密度大気圧プラズマ装置、In-situ 電子スピン共鳴、 ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置、In-Situプ ラズマ照射表面分析装置、表面解析プラズマビーム装置 【実験方法】

超高密度大気圧プラズマ装置を用い、材料表面にプラ ズマ照射して接触角の変化を測定した。ダングリングボン ドの発生をin-situ電子スピン共鳴により測定、解析した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

Fig. 1 に照射時間と接触角の変化を示す。

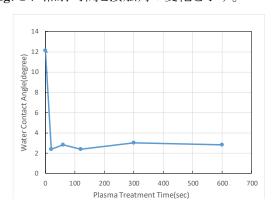


Fig. 1 Water contact angle as function of Ar atomospheric pressure plasma treatment time.

照射初期の段階で接触角が低下し、安定化する。

Fig. 2 に照射時間とESRピーク強度を示す。

ダングリングボンドは、照射初期に急激に増加し、以後、 緩やかに増加をつづける。

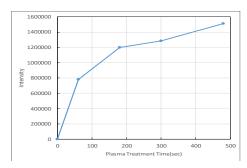


Fig. 2 ESR peak intensity as function of Ar atomosopheric plasma treatment time.

4. その他・特記事項(Others)

・共同研究者:国立大学法人名古屋大学低温プラズマ科 学研究センター・近藤博基准教授

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation) なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。